

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2017年3月9日(09.03.2017)

(10) 国際公開番号

WO 2017/038701 A8

- (51) 国際特許分類:
G01N 23/223 (2006.01) G01N 23/207 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/075033
- (22) 国際出願日: 2016年8月26日(26.08.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-169543 2015年8月28日(28.08.2015) JP
- (71) 出願人: 株式会社リガク (RIGAKU CORPORATION) [JP/JP]; 〒1968666 東京都昭島市松原町3丁目9番12号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 原 真也 (HARA, Shinya); 〒5691146 大阪府高槻市赤大路町14番8号 株式会社リガク 大阪工場内 Osaka (JP). 松尾 尚 (MATSUO, Takashi); 〒5691146 大阪府高槻市赤大路町14番

8号 株式会社リガク 大阪工場内 Osaka (JP). 山田 康治郎 (YAMADA, Yasujiro); 〒5691146 大阪府高槻市赤大路町14番8号 株式会社リガク 大阪工場内 Osaka (JP). 本間 寿 (HONMA, Hisashi); 〒5691146 大阪府高槻市赤大路町14番8号 株式会社リガク 大阪工場内 Osaka (JP). 片岡 由行 (KATAOKA, Yoshiyuki); 〒5691146 大阪府高槻市赤大路町14番8号 株式会社リガク 大阪工場内 Osaka (JP).

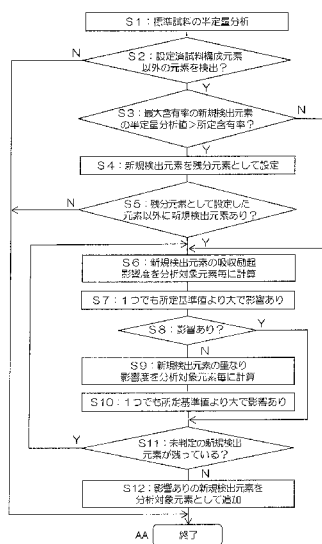
(74) 代理人: 杉本 修司, 外 (SUGIMOTO, Shuji et al.); 〒5500002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番2号 肥後橋ニッタイビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,

[続葉有]

(54) Title: X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER

(54) 発明の名称: 蛍光X線分析装置



(57) Abstract: A scanning-type x-ray fluorescence spectrometer according to the present invention is equipped with a quantitative analysis condition setting means (13) for determining whether a newly detected element other than specimen-constituent elements that are set in advance on the basis of qualitative analysis results and semi-quantitative analysis results obtained from a reference specimen (14) should or should not be added as an element to be analyzed, on the basis of the degree of impact of the x-ray fluorescence absorption and excitation on the analysis values of the elements to be analyzed, and the degree of impact of an overlapping interfering line on the analysis lines of the elements to be analyzed.

(57) 要約: 本発明の走査型の蛍光X線分析装置は、標準試料(14)の定性分析結果および半定量分析結果に基づいて、あらかじめ設定された試料構成元素以外の新規検出元素について、分析対象元素の分析値に対する蛍光X線の吸収励起影響度と、分析対象元素の分析線に対する妨害線の重なり影響度とから、分析対象元素として追加すべきか否かを判定する定量分析条件設定手段(13)を備える。

S1 Semi-quantitative analysis of reference specimen
S2 Element other than set specimen-constituent elements detected?
S3 Maximum content by percentage of newly detected element according to semi-quantitative analysis value > prescribed content by percentage?
S4 Set newly detected element as residual element
S5 Newly detected element other than element set as residual element present?
S6 Calculate degree of impact caused by absorption/excitation of newly detected element for each element to be analyzed
S7 S10: Even one exhibiting impact greater than prescribed reference value
S8 Presence of impact?
S9 Calculate degree of impact caused by overlap of newly detected element for each element to be analyzed
S11 Newly detected element awaiting determination still remaining?
S12 Add newly detected elements exhibiting impact as elements to be analyzed
AA End



LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

(48) この訂正版の公開日: 2017 年 6 月 15 日

(15) 訂正情報:
2017 年 6 月 15 日 の更新情報 (Notice) を参照